

**Beschreibung
fuer
SCSI-Testprogramm**

**Periphere Computer Systeme
Pfaelzerwald Str. 36
8000 Muenchen 90**

THE
LIBRARY
OF THE
CONGRESS

PHOTODUPLICATION SERVICE
1054 DUBLIN AVE.
N.W. WASHINGTON, D.C. 20540

1. Einleitung

Das Programm testet die Schreib-, und Lesefunktion des Omti 20d bzw. DTC 520A Controllers in Verbindung mit 5 1/4" Winchester-, oder Floppy-laufwerken. Ein Controller kann max. zwei Winchester und zwei Floppys bedienen. Es werden sektorweise Daten auf die Floppy bzw. Winchester geschrieben und wieder gelesen. Hierzu wird nicht der UNIX-Treiber, sondern eigene Subroutines benutzt. Durch Datenvergleich und durch Abfrage der Controller Fehleranzeigen oder durch Timeout werden Schreib-, Lese-, und Datenfehler erkannt.

2. Voraussetzung

2.1. Hardware

- QU 68000 System
- Serielle Schnittstelle
- Floppy Disk oder anderer Massenspeicher
- OMTI 20D oder DTC 520 Controller und 5 1/4 " Winchester
- SCSI - Adapter
Adresse: FFFB80(16) Vektor: 230(8)
- Terminator

2.2. Software

- Testprogramm SCSITST

"SCSITST" ist ein in C geschriebens Testprogramm, das mit dem Standalone - Betriebssystem laeuft. Gestartet wird "SCSITST" durch den Minitor.

3. Bedienerfuehrung

3.1. Laden und Starten des Testprogrammes

Nach dem Starten des Systems meldet sich der "Minitor" mit dem Prompt <.>.

Eingabe: .rx<cr>
 ./scsitst<cr>
 .g0<cr>

Nach jedem <cr> meldet sich der "Minitor" mit dem Prompt. Durch g0 wird das Programm gestartet. Das Programm meldet sich mit folgender Systemausgabe.

**** OMTI 20D DTC-520A Test-Programm ****

0 = OMTI 20D
1 = DTC-520A
enter controller type :

Abfrage nach welchem SCSI-Controller

0 = TM 503
1 = TM 603
2 = TM 703
3 = floppy
4 = RO 208
enter drive type :

Abfrage nach welchem Massenspeicher

unit
0..1 = Winchester
2..3 = Floppy
enter unit [0..3] :

Abfrage nach welchem Winchester-, bzw. Floppy-Laufwerk. 0=1., 1=2.
Winchester-Laufwerk, 2=1., 3=2. Floppy-Laufwerk.

Das Programm bietet mehrere Testmodule zur Auswahl an.

Testprogramm-Auswahlliste:

0 = read block
1 = write block
2 = read sequent
3 = write sequent
4 = write + read + compare sequent
5 = write + read + compare zigzag
6 = write sequent read + write random
enter test number :

Hier koennen die verschiedenen Tests ausgewaehlt werden.

test with move multiple [y/n] :

Uebertragungsmodus wort-, bzw. blockweise.

continous test [y/n] :

Es besteht die Moeglichkeit, das Programm im Dauertest zu betreiben.

3.2. Programm-Abbruch

Das Programm kann jederzeit mit "Contr C" abgebrochen werden.

3.3. Fehler- und Statusreport (S)

Waehrend des Programmlaufes wird immer angezeigt, welcher Teilttest gerade laeuft. Durch Druecken der S Taste wird eine Statuszeile ausgegeben. Die Ausgabe enthaelt: Test-Nr., Anzahl der Durchlaeufer und Summe aller Fehler.

3.4. Anhalten der Bildschirmausgabe (W)

Um ein Weglaufen der Terminalinformation zu verhindern wird mit der W-Taste die Ausgabe angehalten. Nach Erkennen der Wait-Funktion wird dies mit "continue <cr>" am Bildschirm angezeigt. Mit der Return-Taste wird die Ausgabe wieder fortgesetzt.

4. Kurzbeschreibung der Testmodule

4.1. Read Block - Write Block

Bei Read Block bzw. Write Block kann ein beliebiger Sektor innerhalb der angegebenen Grenzen ausgewählt werden. Bei ungültiger Sektorgroesse wird die Abfrage wiederholt. Nach dem Lesen bzw. Schreiben wird getestet ob ein Fehler aufgetreten ist.

4.2. Read sequent Write sequent

Auf der Winchester bzw. Floppy werden fortlaufend alle Sektoren mit einem festen Datenmuster beschrieben bzw. gelesen.

4.3. Write Read Compare sequent

Auf der Winchester bzw. Floppy wird fortlaufend ein Zylinder beschrieben, gelesen und die gelesenen Daten mit der Sollinformation verglichen. Zwischen Schreiben und Lesen findet keine Kopfbewegung statt.

4.4. Write Read Compare zigzag

Vom diesem Test werden die Sektoren alternierend (1. Sektor, letzter Sektor, 2. Sektor, usw) ausgewählt, beschrieben, gelesen und mit der Sollinformation verglichen.

4.5. Write sequent Read Write random

Das zu testende Medium wird sequentiell beschreiben. Danach wird nach Zufall ein beliebiger Sektor ausgewählt, gelesen und mit der Sollinformation verglichen. Nun wird der Sektor mit einem anderen Muster beschrieben.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO THE EDITOR:

I am writing to you to inform you of the results of our recent experiments. We have found that the reaction rate is significantly affected by the concentration of the reactants. The data shows a clear trend that can be described by a second-order rate law.

We have also observed that the reaction is highly sensitive to changes in temperature. A small increase in temperature leads to a large increase in the rate constant, which is consistent with the Arrhenius equation.

The mechanism of the reaction appears to involve a bimolecular collision between the reactants, followed by a rapid rearrangement step. This is supported by the kinetic data and the observed transition state structure.

We are currently working on further experiments to confirm these findings and to determine the exact nature of the transition state. We will be happy to share our results with you as soon as they are available.

Very truly yours,
[Signature]
[Name]
[Title]